14h-5CT-21

(19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

## (11)特許出顧公開番号 特開平8-295530

(43)公開日 平成8年(1996)11月12日

(51) Int.Cl. <sup>6</sup>		識別記号	庁内整理番号	ΡI		技術表示箇所
C 0 3 C	3/091			· C03C	3/091	
,	3/093		•		3/093	
G02F	1/1333	500	•	G02F	1/1333	500

審査請求 未請求 請求項の数2 FD (全 5 頁)

(71)出願人 000232243 (21)出願番号 特願平7-129444

日本電気硝子株式会社 (22)出願日 平成7年(1995)4月27日 滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号

(72)発明者 三和 晋吉

滋賀県大津市晴嵐2丁目7番1号 日本電

気硝子株式会社内

#### (54)【発明の名称】 無アルカリガラス基板

#### (57)【要約】

【目的】 本発明の目的は、TFT型アクティブマトリ ックスディスプレイ基板に要求される特性を全て満足す る無アルカリガラス基板を提供することである。

【構成】 本発明の無アルカリガラス基板は、重量百分 率で、SiO2 55~65%、Al2 O3 11~2 0%,  $B_2$   $O_3$   $9\sim15\%$ , MgO  $3\sim10\%$ , CaO 0~4.5%, SrO 0~10%, BaO 0.5~9%, ZnO 0~5%, ZrO2 0~5 %、 $TiO_2$  0~5%、MgO+CaO+SrO+Ba〇+Zn〇 5~20%の組成を有し、実質的にアル カリ金属酸化物を含有せず、密度が2.6g/cm3以 下であることを特徴とする。

(OPIAD) US



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 重量百分率で、SiO2 55~65 % Al<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 11~20% B<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 9~15 %、MgO 3~10%、CaO 0~4.5%、Sr O 0~10%, BaO 0.5~9%, ZnO 0~ 5%、ZrO20~5%、TiO2 0~5%、MgO +CaO+SrO+BaO+ZnO 5~20%の組成 を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、密度 が2.6g/cm³以下であることを特徴とする無アル カリガラス基板。

【請求項2】 重量百分率で、SiO2 55~65 %, A1<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 11~20%, B<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 9~15 %、MgO 3~10%、CaO 0~2%、SrO 0.5~10%, BaO 0.5~9%, ZnO 0~ 5%、ZrO20~1.8%、TiO2 0~5%、M gO+CaO+SrO+BaO+ZnO5~20%の組 成を有することを特徴とする請求項1の無アルカリガラ ス基板。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、液晶ディスプレイ、E レディスプレイ等のディスプレイ、フィルター、センサ 一等の基板として用いられる無アルカリガラス基板に関 するものである。

### [0002]

【従来の技術】従来より液晶ディスプレイ等のフラツト パネルディスプレイ、フィルター、センサー等の基板と してガラス基板が使用されている。

【0003】この種のガラス基板の表面には、透明導電 膜、絶縁膜、半導体膜、金属膜等が成膜され、しかもフ ォトリソグラフィーエッチング (フォトエッチング) に よって種々の回路やパターンが形成される。これらの成 膜、フォトエッチング工程において、ガラス基板には、 種々の熱処理や薬品処理が施される。

【0004】例えば薄膜トランジスタ(TFT)型アク ティブマトリックス液晶ディスプレイの場合、ガラス基 板上に絶縁膜や透明導電膜が成膜され、さらにアモルフ ァスシリコンや多結晶シリコンのTFTが、フォトエッ チングによって多数形成される。このような工程におい て、ガラス基板は、数百度の熱処理を受けると共に、硫 40 ガラス基板の表面に変質や白濁、荒れが生じやすく、し 酸、塩酸、アルカリ溶液、フッ酸、バッファードフッ酸 等の種々の薬品による処理を受ける。特にバッファード フッ酸は、絶縁膜のエッチングに広く用いられるが、ガ ラスを侵食してその表面を白濁させやすく、またガラス 成分と反応して反応生成物ができ、これが工程中のフィ ルターをつまらせたり、基板上に付着するため、この種 のガラス基板には、耐バッファードフッ酸性を付与する ことが大変重要である。

【0005】従ってTFT型アクティブマトリツクス液 晶ディスプレイに使用されるガラス基板には、以下のよ 50 しないというのが実情である。

うな特性が要求される。

【0006】(1)ガラス中にアルカリ金属酸化物が含 有されていると、熱処理中にアルカリイオンが成膜され た半導体物質中に拡散し、膜特性の劣化を招くため、実 質的にアルカリ金属酸化物を含有しないこと。

2

【0007】(2)フォトエッチング工程において使用 される種々の酸、アルカリ等の薬品によって劣化しない ような耐薬品性を有すること。

【0008】(3)成膜、アニール等の工程における熱 10 処理によって、熱収縮しないこと。そのため高い歪点を 有すること。

【0009】また溶融性、成形性を考慮して、この種の ガラス基板には、以下のような特性も要求される。

【〇〇10】(4)ガラス中に基板ガラスとして好まし くない溶融欠陥が発生しないよう、溶融性に優れている こと。

【0011】(5)ガラス中に溶融、成形中に発生する 異物が存在しないように、耐失透性に優れていること。

【0012】また近年、TFT型アクティブマトリック 20 ス液晶ディスプレイ等の電子機器は、パーソナルな分野 への利用が進められており、機器の軽量化が要求されて いる。これに伴ってガラス基板にも軽量化が要求されて おり、薄板化が進められている。しかしながらこの種の 電子機器は、大型化も進められており、ガラス基板の強 度を考慮すると、薄板化については自ずと限界がある。 そこでガラス基板の軽量化を図る目的で、ガラスの密度 を低くすることが望まれている。

#### [0013]

【発明が解決しようとする課題】従来よりTFT型アク ティブマトリックスディスプレイ基板に用いられている 無アルカリガラスとしては、石英ガラス、バリウム硼珪 酸ガラス及びアルミノ珪酸塩ガラスが存在するが、いず れも一長一短がある。

【0014】すなわち石英ガラスは、耐薬品性、耐熱性 に優れ、低密度であるが、材料コストが高いという難点

【0015】またバリウム硼珪酸ガラスとしては、市販 品としてコーニング社製井7059が存在するが、この ガラスは耐酸性に劣り、フォトエッチング工程において かも基板からの溶出成分によって薬液を汚染しやすい。 さらにこのガラスは、歪点が低いため、熱収縮や熱変形 を起こしやすく、耐熱性に劣っている。またその密度も 2.76g/cm³ と高い。

【0016】アルミノ珪酸塩ガラスは、耐熱性に優れて いるが、現在市場にあるガラス基板の多くが、溶融性が 悪く、大量生産に不向きである。またこのガラス基板 は、密度が高かったり、耐バッファードフッ酸性に劣る ものが多く、全ての要求特性を満足するものは未だ存在

悪化する。

【0017】本発明の目的は、上記した要求特性項目 (1)~(5)を全て満足し、しかも密度が2.6g/cm³以下である無アルカリガラス基板を提供することである。

#### [0018]

【課題を解決するための手段】本発明の無アルカリガラス基板は、重量百分率で、SiO2 55~65%、Al2O3 11~20%、B2O3 9~15%、MgO3~10%、CaO 0~4.5%、SrO 0~10%、BaO 0.5~9%、ZnO 0~5%、Z10rO2 0~5%、TiO2 0~5%、MgO+CaO+SrO+BaO+ZnO 5~20%の組成を有し、実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、密度で2.6g/cm³以下であることを特徴とする。

【0019】また本発明の無アルカリガラス基板は、好ましくは、重量百分率で、SiO255~65%、Al2O3 11~20%、B2O3 9~15%、MgO3~10%、CaO 0~2%、SrO 0.5~10%、BaO 0.5~9%、ZnO 0~5%、ZrO2 0~1.8%、TiO2 0~5%、MgO+Ca 20O+SrO+BaO+ZnO 5~20%の組成を有することを特徴とする。

#### [0020]

【作用】以下、本発明の無アルカリガラス基板の構成成分を上記のように限定した理由を説明する。

【0021】SiO₂は、ガラスのネットワークフォーマーとなる成分であり、その含有量は、55~65%である。55%より少ないと、耐薬品性、特に耐酸性が低下すると共に歪点が低くなるため耐熱性が悪くなり、且つ、ガラスの密度を2.6g/cm³以下にすることが30困難となる。また65%より多いと、高温粘度が大きくなり、溶融性が悪くなるとと共にクリストバライトの失透物が析出しやすくなる。

【0022】A12 O3 は、ガラスの耐熱性、耐失透性を高めると共に、密度を低下させるために不可欠な成分であり、その含有量は、11~20%である。11%より少ないと、失透温度が著しく上昇し、ガラス中に失透異物が生じやすくなる。また20%より多いと、耐酸性、特に耐バッファードフッ酸性が低下し、ガラス基板の表面に白濁が生じやすくなる。

【0023】B₂ O₃ は、融剤として働き、粘性を下げ、溶融性を改善すると共に密度を低下させるための成分であり、その含有量は、9~15%である。9%より少ないと、融剤としての働きが不十分となると共に、ガラスの密度が高くなり、しかも耐バッファードフッ酸性が低下する。また15%より多いと、ガラスの歪点が低下し、耐熱性が悪くなると共に、ガラスの耐酸性も悪くなる。

【0024】MgOは、歪点を下げずに高温粘性を下 bOは、溶融時に融液の表面からげ、ガラスの溶融性を改善する作用を有しており、二価 50 る虞れもあるため好ましくない。

のアルカリ土類酸化物の中で、最も密度を下げる効果が大きい成分であり、その含有量は、 $3\sim10\%$ である。 3%より少ないと、上記の効果が得られず、10%より 多いと、失透温度が著しく上昇し、エンスタタイト (MgO·SiO2) の結晶異物がガラス中に析出しやすく なると共に、ガラスの耐バッファードフッ酸性が著しく

【0025】CaOも、MgOと同様に歪点を下げずに 高温粘性を下げ、ガラスの溶融性を改善する作用を有す る成分であり、その含有量は、0~4.5%、好ましく は0~2%である。4.5%より多いと、ガラスの耐バ ッファードフッ酸性が著しく悪化する。

【0026】SrO、BaOは、共にガラスの耐薬品性を向上させると共に、失透性を改善するための成分であるが、多量に含有させると、溶融性を損なうと共にガラスの密度が高くなるため好ましくない。従ってSrOの含有量は、0~10%、好ましくは0.5~10%であり、BaOの含有量は、0.5~9%である。

【0027】ZnOは、耐バッファードフッ酸性を改善すると共に、失透性を改善する成分であり、その含有量は、0~5%である。5%より多いと、逆にガラスが失透しやすくなると共に、歪点が低下するため耐熱性が得られない。

【0028】ただしMgO、CaO、SrO、BaO及びZnOの合量が5%より少ないと、ガラスの高温での粘性が高くなり、溶融性が悪くなると共に、ガラスが失透しやすくなり、20%より多くなると、ガラスの密度が高くなり、2.6g/cm³以下にするのが困難となる。

30 【0029】 ZrO2 は、ガラスの耐薬品性、特に耐酸性を改善すると共に、高温粘性を下げて溶融性を向上させる成分であり、その含有量は、0~5%、好ましくは0~1.8%である。5%より多いと、失透温度が上昇し、ジルコンの失透異物が析出しやすくなる。

【0030】TiO2 は、耐薬品性、特に耐バッファードフッ酸性を改善すると共に、高温粘性を低下し溶融性を向上させる成分であり、その含有量は、0~5%である。5%より多いと、ガラスに着色を生じ、透過率が低下するためディスプレイ用ガラス基板として好ましくな40 い。

【0031】また本発明においては、上記成分以外にも、特性を損なわない範囲で他の成分を添加させることが可能であり、例えば清澄剤としてAs2 O3、Sb2 O3、F2、C12、SO3 等の成分を添加させることが可能である。

【0032】ただし一般に融剤として使用されるPbOとP2 O5 は、ガラスの耐薬品性を著しく低下させるため、本発明においては添加を避けるべきである。特にPbOは、溶融時に融液の表面から揮発し、環境を汚染する底れもあるため好ましくない。

5

[0033]

\*1~9)と比較例のガラス(試料No. 10~13)を

【実施例】以下、本発明の無アルカリガラス基板を実施 示すものである。 例に基づいて詳細に説明する。 【0035】

例に基づいて詳細に説明する。 【0034】表1、2は、実施例のガラス(試料No.\*

【表1】

(重量%)

MAKA			実	施	例		
組成	1	2	3	4	5	6	7
SiOz	56.5	57.5	58.5	58.5	59.5	80.5	82.0
AlgOs	12.5	18.5	15.5	15.5	15.5	15.5	14.0
BaOs	13.5	9.5	10.5	11.5	11.5	10.5	12.0
MgO	3.5	4.0	5.0	4.0	3.5	4.0	8.0
CaO	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	1.5	_
SrO	5.0	2.0	3.5	3.6	2.5	3.5	1.0
BaO	2.5	7.0	4.5	5.5	6.0	4.5	1.0
2 n O	4.0	-	1.0	-	-		2.5
Z r O <sub>2</sub>	ł	1.0		-	ı	_	1.5
TiO2	2.0	-		-	_	-	
密度 (g/cn³)	2.50	2.47	2.49	2.48	2.46	2.46	2.38
歪点 (℃)	644	681	657	654	656	862	655
失透温度(℃)	1045	1043	1078	1064	1071	1077	1088
102.5f/沈陂(飞)	1463	1571	1519	1537	1553	1580	1537
耐硫酸性	0	0	0	0	0	0.	0
耐パッファード フッ酸性	0	0	0	0	0	0	0

[0036]

※ ※【表2】

試料加	実が	E 61	Ŀ	t 18	Ż £	M
組成	8	8	10	11	12	18
S i O <sub>2</sub>	57.0	·81.0	49.0	55.5	58.0	80.0
A 1 2 O 2	15.5	13.0	11.0	11.0	14.0	15.0
B <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	13.0	12.8	15.0	7.0	12.0	10.0
ΜgΟ	3.5	8.0	-	2.0	4.0	2.0
CaO	1.6	1.7		3.5	5.0	4.2
SrO	7.0	1,5	_	7.0	- 2.6	2.3
ВаО	2.4	1.0	25.0	14.0	4.4	8.5
ZnO	_	-		-	-	-
ZrO2	-	_	-	-	. –	
T 1 O2	_	1.0	_	<b>-</b>	_	
密度(g/cn <sup>0</sup> )	2.48	2.39	2.76	2.77	2.49	2.55
歪点 (℃)	645	841	590	635	642	650
失透温度(℃)	1032	1090	1000	1180	1060	1200
102.54代腹(飞)	1482	1453	1470	1520	1469	1831
耐碳酸性	0	0	×	0	0	0
耐バッファード フッ酸性	0	0	0	×	×	0

【0037】表中の各試料は、次のようにして作製した。まず表の組成となるようにガラス原料を調合し、白金坩堝に入れ、1580℃で、16時間溶融した後、カーボン板上に流し出し、板状に成形した。次いでこれらの板状ガラスの両面を光学研磨することによってガラス基板としたものである。

【0038】表から明らかなように、実施例であるN o.  $1\sim9$ の各試料は、いずれも密度が2.6g/cm  $^3$  以下、歪点が640  $^{\circ}$  C以上、失透温度が1100  $^{\circ}$  C以下、 $10^{2.5}$  ポイズに相当する温度が1580  $^{\circ}$  C以下であり、いずれも良好な特性を有していた。またこれらの試料は、耐硫酸性と耐バッファードフッ酸性にも優れていた。

【0039】それに対し、比較例であるNo.10の試料は、密度が大きいため、実施例の試料に比べて重量が大きいものと考えられる。しかも歪点が低いため、耐熱性に劣り、且つ、耐硫酸性についても劣っていた。またNo.11の試料も、密度が大きく、歪点がやや低かった。さらに失透温度が高いため、溶融性に劣り、且つ、耐バッファードフッ酸性についても劣っていた。さらにNo.12の試料は、耐バッファードフッ酸性が劣り、No.13の試料は、高温粘度が高く、溶融性に劣ると共に、失透温度も高かった。

【0040】尚、表中の密度は、周知のアルキメデス法によって測定したものである。また歪点は、ASTMC336-71の方法に基づいて測定し、失透温度は、\*50

\*各試料から300~500μmの粒径を有するガラス粉末を作製し、これを白金ボート内に入れ、温度勾配炉に24時間保持した後の失透観察によって求めたものである。

【0041】また10<sup>2.5</sup> ボイズ温度は、高温粘度であ 0 る10<sup>2.5</sup> ボイズに相当する温度を示すものであり、こ の温度が低いほど、溶融、成形性に優れていることにな る

【0042】さらに耐硫酸性は、各試料を80℃に保持された10重量%硫酸水溶液に24時間浸漬した後、ガラス基板の表面状態を観察することによって評価した。ガラス基板の表面が、白濁したり、クラック等が入ったものを×、全く変化がないものを○で示した。

【0043】また耐バッファードフッ酸性は、各試料を、20℃に保持された38.7重量%フッ化アンモニウム、1.6重量%フッ酸からなるバッファードフッ酸に30分間浸漬した後、ガラス基板の表面状態を観察することによって評価した。ガラス基板の表面が白濁しているものを×、全く変化のなかったものを○で示した。【0044】

【発明の効果】以上のような本発明の無アルカリガラス 基板は、実質的にアルカリ金属酸化物を含有せず、耐熱 性、耐薬品性、溶融成形性に優れ、しかも低密度である ため、特に軽量化が要求されるTFT型アクティブマト リックス基板として好適である。 THIS PAGE BLANK (USPTO)